

DG1S4**40V 1A****特長**

- ・超小型SMD
- ・超薄型=0.8mm
- ・低VF=0.55V

Feature

- Ultra-small SMD
- Ultra-thin PKG=0.8mm
- Low VF=0.55V

用途

- ・スイッチング電源
- ・DC/DCコンバータ
- ・家電、ゲーム、OA機器
- ・通信

Main Use

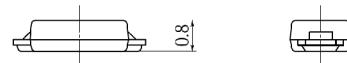
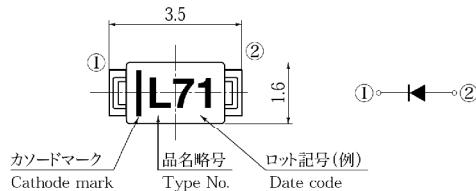
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication

■外観図 OUTLINE

Package : G1F

Unit:mm

Weight 0.011g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は「ダイオードカタログ・技術資料編」を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_l = 25°C)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DG1S4	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			40	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T _a = 27°C *1 T _a = 36°C *2	0.7 1.0	A
せん頭サーボ電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C		30	

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_l = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 0.7A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.8	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 37	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	*1	MAX 210
			*2	MAX 120
			*3	MAX 70
	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	*3	MAX 20

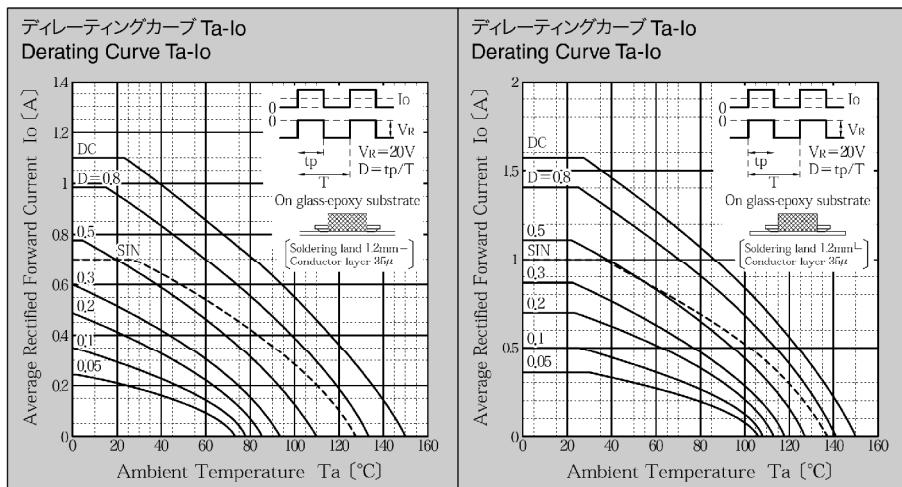
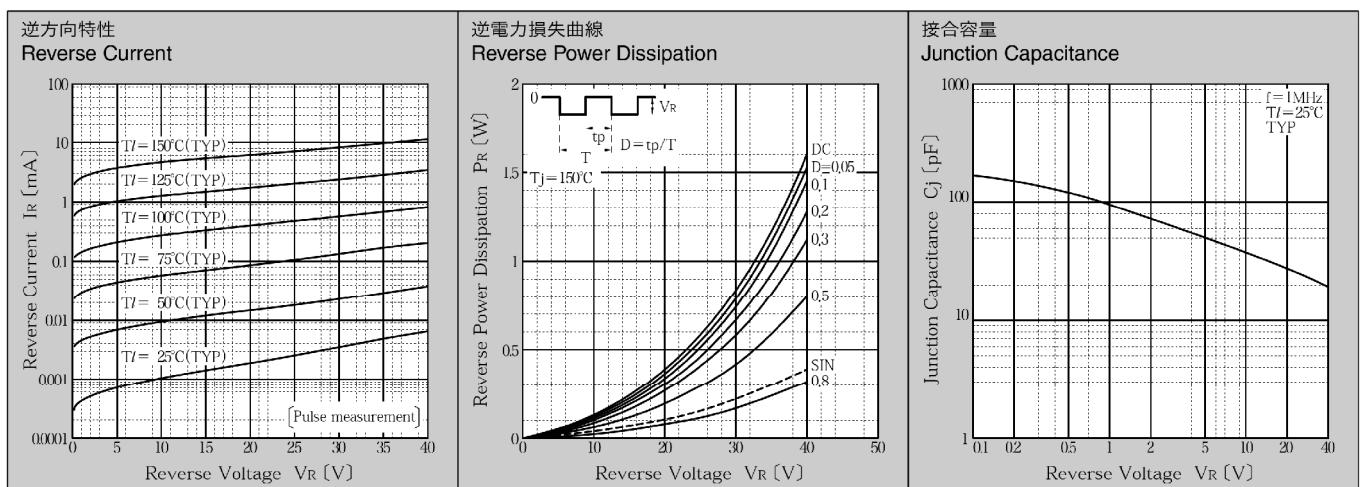
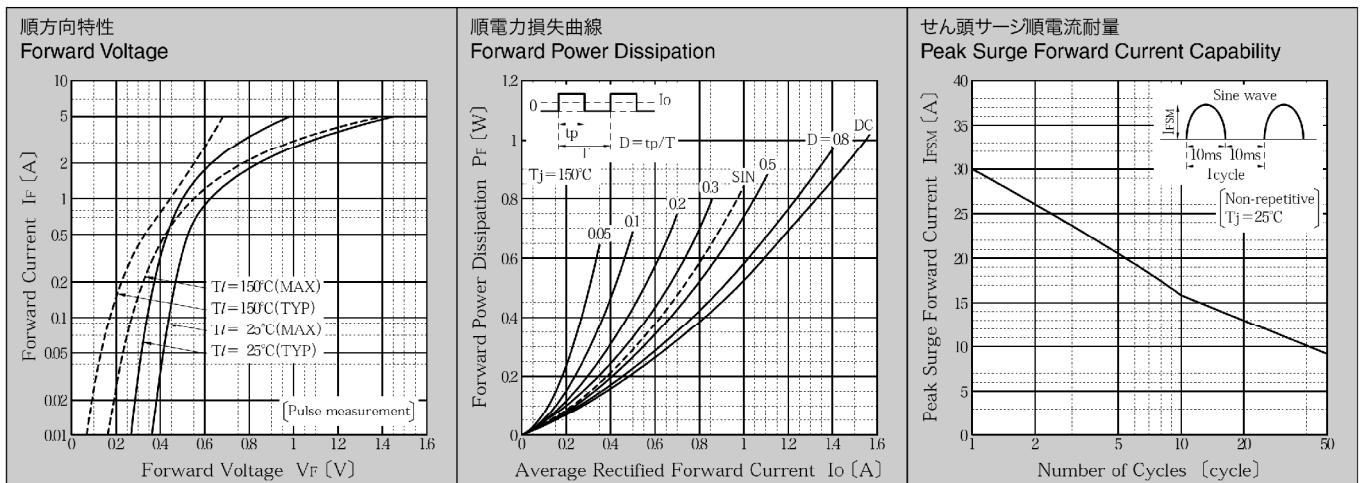
*1 1インチプリント基板 (パターン32.6mm²)
Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area : 32.6mm²)

*2 1インチプリント基板 (パターン160mm²)
Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area : 160mm²)

*3 2インチアルミナ基板 (パターン2,100mm²)
Measured on 2 x 2 inch alumina substrate (pattern area : 2,100mm²)

Small SMD

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



*1インチプリント基板 (パターン32.6mm²)
Measured on 1 x 1 inch substrate
(pattern area 32.6mm²)

*1インチプリント基板 (パターン160mm²)
Measured on 1 x 1 inch substrate
(pattern area 160mm²)

* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は、一般的にバラツキを持っております。
Typical is statistical average of the device's ability.
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.